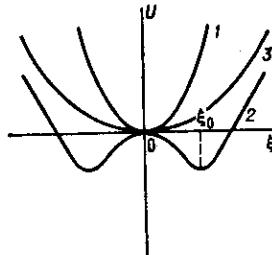


перехода 2-го рода, то можно исследовать устойчивость идеальной поверхности относительно разл. смещений поверхностных атомов из положений равновесия. Любое смещение поверхностного атома можно представить в виде суперпозиции смещений, соответствующих нормальным колебаниям (см. Колебания кристаллической решётки). Смещение ξ поверхностного атома из положения равновесия ξ_0 характеризуется волновым вектором q_{\parallel} , параллельным поверхности. Если смещение поверхностного атома приводит к увеличению потенц. энергии U (кривая 1, рис. 3), то исходному состоянию

Рис. 3. Зависимость потенциальной энергии U от величины смещения поверхностного атома ξ : кривая (1) соответствует устойчивому равновесию; кривая (2) изображена с учётом ангармонизма колебаний и соответствует реконструированной поверхности; ξ_0 — новые положения равновесия.



поверхности соответствует минимум U и поверхность устойчива. Если смещение поверхностных атомов приводит к уменьшению потенц. энергии (кривая 2 вблизи начала координат), то исходное состояние соответствует максимуму потенц. энергии. Поверхность при этом неустойчива, происходит Р. п. Новые положения равновесия ξ_0 определяются ангармонизмом колебаний. С учётом ангармонич. членов $U(\xi)$ имеет вид полной кривой 3.

Условие максимума или минимума потенц. энергии определяется знаком производной $d^2U/d\xi^2$, к-рая пропорц. квадрату частоты поверхностного колебания $\omega^2(q)$. Значение q^* , для к-рого $\omega(q^*) = 0$ (мягкая мода), соответствует колебанию, по отношению к к-рому поверхность неустойчива. Именно q^* определяет пространственный период новой устойчивой поверхностной конфигурации атомов, соответствующей реконструированной поверхности.

На рис. 4. приведены 2 примера Р. п. (100) кубич. кристалла. Если мягкая мода возникает в точке X

зоны Бриллюэна (см. Бриллюэна зона) с координатами ($q_x^* = \pi/a$, $q_y^* = 0$), то на поверхности устанавливается «волна» статич. смещений с периодом $\lambda = 2\pi/q_x^* = 2a$, где a — период нереконструированной поверхности. Возникают чередующиеся ряды поднявшихся вверх и опустившихся вниз атомов. Происходит удвоение периода решётки вдоль оси x . Если мягкая мода возникает в точке M зоны Бриллюэна с координатами

$$(q_x^* = \pi/a, q_y^* = \pi/a),$$

то на поверхности устанавливается волна статических смещений в направлении, составляющем угол 45° с осями Ox и Oy и с периодом

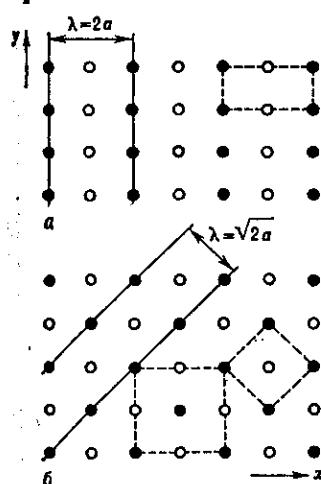


Рис. 4. Примеры реконструкции поверхности (100) кубического кристалла: а — реконструкция за счёт мягкой моды в точке X зоны Бриллюэна; новая элементарная ячейка показана пунктиром; б — реконструкция за счёт мягкой моды в точке M зоны Бриллюэна; новая элементарная ячейка показана пунктиром.

$$\lambda = 2\pi \left[\left(\frac{q_x^*}{a} \right)^2 + \left(\frac{q_y^*}{a} \right)^2 \right]^{-1/2} = \sqrt{2}a.$$

Такую структуру обозначают $(2 \times 2)R 45^\circ$ или $C(2 \times 2)$.

Возможные перестройки поверхности, происходящие по типу фазового перехода 2-го рода, можно найти теоретико-групповыми методами. Р. п. охватывает неск. приповерхностных кристаллич. плоскостей, составляющих приповерхностный слой [4].

Р. п. с большим периодом, напр. структуры (7×7) на поверхности (111) Si, связывают с возникновением узкой энергетич. зоны поверхности состояний для электронов оборванных связей. На поверхности (111) Si на каждый поверхностный атом приходится 1 оборванная связь. Поэтому зона поверхностных состояний заполнена только наполовину. Энергию электрона в такой зоне можно рассчитывать методом сильной связи (см. Зонная теория):

$$\epsilon = \epsilon_0 - 2J \left[\cos p_x a + 2 \cos \frac{p_x a}{2} \cos \frac{\sqrt{3} p_y a}{2} \right].$$

Здесь p_x и p_y — проекции квазимпульса электрона, J — интеграл перекрытия электронных волновых ф-ций. Ферми-поверхность для таких электронов является шестиугольником. Из-за наличия плоских граней электрон-фононное взаимодействие даёт аномально большой сдвиг частоты нормального колебания с волновым вектором $q_{\parallel} = 2p_F$ (p_F — импульс Ферми). Если при нек-ром сдвиге частоты результирующая частота $\omega^2(2p_F) = 0$, то поверхность кристалла неустойчива относительно такого колебания и произойдёт Р. п. Устойчивое состояние соответствует волне статич. смещений с длиной волны $\lambda = 2\pi/q_{\parallel} = \pi/p_F$, солизермий с постоянной решётки $\lambda l = na$, где n и l — целые числа. Период новой структуры определяется числом n . Для поверхности (111) Si число $n = 7$, что соответствует структуре (7×7) .

Исследования атомарно-чистой поверхности важны для понимания свойств границы раздела кристаллов. По-видимому, нач. стадии адсорбции и роста кристаллов (см. Кристаллизация) определяются свойствами реконструированных границ раздела [5].

Лит.: 1) Н а у м о в е ц А. Г., Исследование структуры поверхности методом дифракции медленных электронов: достижения и перспективы, «Укр. физ. ж.», 1978, т. 23, № 10, с. 1585; 2) Photoemission and electronic properties of surfaces, ed. by B. Feuerbacher, B. Fitton, R. F. Willis, Chichester — [a.o.], 1978; 3) O l i s h a n e t s k y B. Z., S h k l i u a e v A. A., Phase transition on clean Si (110) surfaces, «Surf. Sci.», 1977, v. 67, p. 581; 4) I p a t o v a I. P., K a t a e v Yu. E., Landau theory of second-order, phase transitions on solid surfaces, «Prog. in Surf. Sci.», 1985, v. 18, № 3, p. 189; 5) A b s t r e i g G., Inelastic light scattering in semiconductor heterostructures, в кн.: Festkörperprobleme, v. 24 — Advances in solid state physics, Braunschweig, 1984.

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — процесс образования и роста (или только роста) структурно более совершенных кристаллич. зёрен **поликристалла** за счёт менее совершенных зёрен той же фазы. Р. начинается при нек-рой темп-ре T_p , к-рая зависит от хим. состава, концентрации дефектов, в частности дислокаций. Далее с повышением темп-ры T скорость Р. растёт. Особенно интенсивно она протекает в пластически деформированных материалах (см. Пластичность). Зародышами новых зёрен являются дислокации, ячейки.

Различают 3 стадии Р.: первичную, когда в деформиров. материале образуются новые неискажённые зёра, к-рые растут, поглощая зёра, искажённые деформацией; собирательную Р. — неискажённые зёра растут за счёт друг друга, вследствие чего ср. величина зёра увеличивается; вторичную Р., к-рая отличается от собирательной тем, что способностью к росту обладают только немногие из неискажённых зёрен. В ходе вторичной Р. структура характеризуется разр. размерами зёрен. Движению **межзёренных границ** препятствуют дисперсные частицы (размером \sim им) др. твёрдых фаз (оксидов, карбидов и т. д.) и субмикропоры;